

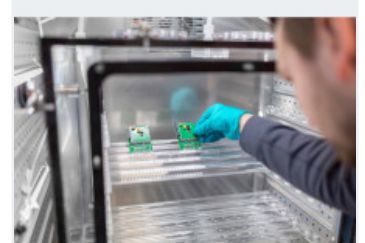
Mikroskopische Untersuchungen

TechnoLab präsentierte auf der SMT in Nürnberg Neuerungen und bewährte Analyseverfahren für das Aufspüren von Fehlerursachen an Leiterplatten, elektronischen Baugruppen, Komponenten und Materialien.

Produktbericht

Im Fokus stand unter anderem ein Mikroskopisches Testverfahren: Das zur Demonstration verwendete Mikroskop Typ Leica DM2700 ist ein aufrechtes Materialmikroskop mit einer bis 1000-fachen Vergrößerung. Ein entsprechendes Gerät verwendet das Unternehmen zur Bewertung metallografischer Präparate. Angeschlossen ist eine Kamera MC190HD.

Zudem stand die Fourier-Transform-Infrarot-Spektroskopie (FTIR) im Mittelpunkt: Für Interessenten wurden Anwendungen der FTIR-Analyse und der FTIR-Mikroskopie zur Identifizierung organischer Materialien, wie z.B. Kunststoffteilen, Flüssigkeiten oder Rückständen, und zur Fehleranalyse an elektronischen Baugruppen und Komponenten vorgestellt.
(mrc)



Schadgastest nach IEC 60068-2-60 zur Prüfung elektronischer Baugruppen.
(Bild: TechnoLab)

Newsletter

Das Neueste von **all-electronics** direkt in Ihren Posteingang!

● WEITERE INFOS

TechnoLab GmbH

Wohlrabedamm 13

13629 Berlin

Deutschland

[Zum Firmenprofil >](#)